

[Alle Produkte](#) / [Optikkomponenten](#) / [Optische Spiegel](#) / [Planspiegel](#) / [Laserspiegel](#)

Planspiegel für extremes Ultraviolett (EUV-Planspiegel)



- Maximal erreichbare Reflexion bei 13,5 nm
- Entwickelt zur EUV-Strahlumlenkung und Abtrennung von Oberwellen
- Versionen für 5° und 45° Einfallswinkel erhältlich

Spezifikationen

Physikalische und mechanische Eigenschaften

Durchmesser (mm):	25.40 ±0.25	Rückseite:	Commercial Polish
Freie Apertur (%):	90	Kanten:	Fine Ground
Parallelität (Bogenminuten):	3	Oberflächenrauheit (Angström):	<5 RMS
Dicke (mm):	6.35 ±0.508		

Optische Eigenschaften

Oberflächenebenheit (P-V):	λ/10 @ 632.8nm		
Substrat:	Single Crystal Silicon	Oberflächenqualität:	10-5
Beschichtung:	Mo/Si Multilayer Top Layer: Silicon	Art der Beschichtung:	Metal/Semiconductor
Designwellenlänge DWL (nm):	13.5		

Elektronische Spezifikationen

Zentralenergie (eV):	92
----------------------	----

Technische Informationen

Produkte

Durchm. (mm)	Beschichtungsspezifikation	Beschichtung	AOI (°)	Dicke (mm)	Artikelnummer	Preis	Kaufen
25.40	R _{abs} >60% @ 13.5nm, 5° (s-pol)	Mo/Si Multilayer Top Layer: Silicon	5	6.35	#38-759	€2.595,60	5 In Stock
25.40	R _{abs} >65% @ 13.5nm, 45° (s-pol)	Mo/Si Multilayer Top Layer: Silicon	45	6.35	#38-760	€2.595,60	20+ In Stock



Copyright 2023 | Edmund Optics, Ltd Unit 1, Opus Avenue, Nether Poppleton, York, YO26 6BL, UK
Telefonnr.: 1-800-363-1992 :
www.edmundoptics.com